CONTESTACIONES CUESTIONARIO-1. Orden Aleatorio

 Suponga que disponemos de un conjunto de 1000 muestras etiquetadas de un problema de clasificación binaria....

Respuesta: Dividir la muestra en conjuntos de entrenamiento y validación en rango (90 %-10 % a 80 %-20 %): (N-K,K). Entrenar los 5 modelos y elegir el de menor error de validación. La cota

$$P(|E_{\text{out}} - E_{\text{val}}| < \epsilon) > 2 \times 5 \times e^{-2\epsilon^2 K}$$

 $|E_{\text{out}} - E_{\text{val}}| \le \sqrt{\frac{ln10 - ln\delta}{2K}}$

• Suponga un problema de predicción bien definido que hace uso de una clase de funciones \mathcal{H} . Suponga que dicha clase \mathcal{H} es suficiente como para hacer que $E_{in} \to 0$ para cualquier muestra de un tamaño dado N...

Respuesta: Dado que $E_{in} \to 0$ para toda muestra de tamaño N, en general, la clase \mathcal{H} estará sobreajustando la muestra debido a la presencia natural de ruido estocástico. Al ir reduciendo la complejidad de la clase el sesgo de la estimación aumentará y la varianza disminuirá pero en total el error por sobreajuste disminuirá hasta alcanzar un mínimo. Si continuamos reducciendo complejidad el error del sesgo crecerá más que la disminución de la varianza, dando lugar a un aumentando del sobreajuste. La complejidad de la clase en la que se alcanza el mínimo del error por sobreajuste depende del tamaño N de la muestra, siendo en general creciente con N.

• Suponga que debe etiquetar muestras en un problema de clasificación binario donde desconoce la función de etiquetado f, pero conoce la distribución muestral \mathcal{P}

Respuesta: Aplicar la regla de Bayes: asignar a la clase de mayor probabilidad. Esta regla garantiza el mínimo error posible.

■ Considere la función de error $E_n(\mathbf{w}) = (\max(0, 1 - y\mathbf{w}^T\mathbf{x}))^2$. Deducir la regla de adaptación de gradiente descendente para el parámetro \mathbf{w}

Respuesta:

$$\nabla E_n = \left\{ \begin{array}{ccc} 0 & si & y\mathbf{w}^T\mathbf{x} \ge 1) \\ 2\mathbf{x}(\mathbf{w}^T\mathbf{x} - y) & si & y\mathbf{w}^T\mathbf{x} < 1 \end{array} \right.$$

Regla adaptación para w:

$$\mathbf{w}_{t+1} = \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbf{w}_t & si & y\mathbf{w}^T\mathbf{x} \ge 1 \\ \mathbf{w}_t - 2\lambda\mathbf{x}(\mathbf{w}^T\mathbf{x} - y) & si & y\mathbf{w}^T\mathbf{x} < 1 \end{array} \right.$$

Regla adaptación para $E_{in}(\mathbf{w}) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} E_n(\mathbf{w})$:

$$\mathbf{w}_{t+1} = \mathbf{w}_t - \frac{2\lambda}{N} \sum_{i: y_i \mathbf{w}^T \mathbf{x}_i < 1} \mathbf{x}_i (\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i - y_i)$$

 Cuando resolvemos un problema de aprendizaje desde datos cuales de las siguientes opciones son correctas:...

Respuesta: Opción (c). Suponemos una clase de funciones finita sin perdida de generalidad. Si con la clase de funciones usada $E_{\rm in}$ es grande hemos fallado. En caso contrario habremos obtenido una solución PAC.

■ Suponga el siguiente escenario. Un matemático que no cree en la teoría del aprendizaje desde datos le reta a que averigue una función de etiquetado $f: \mathcal{R} \to \{-1, +1\}$...

Respuesta: El problema define una inducción determinista y por tanto no hay solución al mismo.

 Considere el mismo escenario de la pregunta anterior. Ahora el matemático le permite que Ud. añadir una información extra...

Respuesta: Una distribucción de probabilidad sobre el espacio de las muestras. En esas condiciones una clase finita de funciones es siempre PAC-aprendible

■ En regresión hemos introducido la función de error $\mathbf{e}(\mathbf{x}) = (h(\mathbf{x}) - y)^2$ entre predicción y etiquetas. Sin embargo posibles medidas aberrantes de las y producen valores de error enormes que condicionan la búsqueda de buenas soluciones....

Respuesta: Claramente Error alcanzará su mínimo cuando $h(\mathbf{z})$ tome un valor entre z_1 y z_N . Analizando el valor Error cuando $h(\mathbf{z})$ avanza desde z_1 a z_N se observa que el valor de Error decrece linealmente con el número de muestras que deja a su izquierda y crece con el número de muestras que deja a su derecha. Por tanto alcanzara el mínimo cuando tenga tantas muestras a su derecha como a su izquierda. Esto es por definción la mediana(\mathbf{z}). Dado que la mediana solo tiene en cuenta el número de datos a su izquierda y derecha las observaciones aberrantes no tienen mayor influencia en el valor de estimador que cualquier otro punto. En conclusión minimizar la métrica L_1 de los errores produce soluciones robustas

• Considere un modelo de "bin" para modelar una hipótesis h que comete un error al aproximar una función determinística f.

Respuesta:
$$P[h(x) \neq y] = P[h(x) \neq f(x)]P[f(x) = y] + P[h(x) = f(x)]P[f(x) \neq y] = (1 - \mu)(1 - \lambda) + \mu\lambda = 2\mu\lambda - \mu - \lambda + 1$$
 Cuando $2\mu\lambda - \mu = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$

• Consideremos un problema de clasificación binaria probabilístico con etiquetas $\{+1, -1\}$ donde la solución probabilística sin costes esta dada por la función

$$g(x) = \mathbb{P}[y = +1|\mathbf{x}]$$

Suponga que la matriz de coste...

Respuesta: De acuerdo a la regla de Bayes la regla sería asignar a la clase más probable. Los pesos se incorporan a esta regla haciendo que el coste promedio (error) de ambas clases sea igual, es decir $10 \cdot g(\mathbf{x}) = 1000 \cdot (1 - g(\mathbf{x}))$. Por tanto asignar +1 si $g(\mathbf{x}) \geq \frac{1000}{1010}$.

■ Es bien conocido que la investigación en "Machine Learning"ha ido produciendo distintas técnicas exitosas para aproximar problemas de clasificación: k-nn, árboles,SVM, NN, AdaBoost, etc...

Respuesta: Ninguno. No existe el mejor algoritmo para todas las distribuciones como se deduce de los resultados del teorema Non-Free Lunch.

Considere $E_n(\mathbf{w}) = \mathbf{max}(\mathbf{0}, \mathbf{1} - \mathbf{y_n} \mathbf{w^T} \mathbf{x_n})$. Mostra que $E_n(w)$ es una cota superior... **Respuesta:** $[[sign(\mathbf{w}^T \mathbf{x_n}) \neq sign(y_n)]]$ toma valores 0 y 1. Cuando toma el valor 0 $max(0, 1 - y_n \mathbf{w}^T \mathbf{x_n})$ es también igual a 0 y para el valor 1 $max(0, 1 - y_n \mathbf{w}^T \mathbf{x_n})$ toma valores extrictamente mayores a 1.

Por el resultado anterior $E_{\text{in}} = \frac{1}{N} \sum_{n} [[sign(\mathbf{w}^T \mathbf{x_n}) \neq sign(y_n)]] \leq \frac{1}{N} \sum_{n} E_n(w)$